

Publikationen

W.Hauffe: **Ionenstrahlen verändern Festkörperoberflächen**

Spectrum I/83, Monatsschrift der Akademie der Wissenschaften der DDR
S.18 – 21 (1983)

W.Hauffe: **Development of the Surface Topography on polycrystalline Metals by Ion Bombardment Investigated by Scanning Electron Microscopy**

Phys. Stat. Sol.(a) **4**, 111-120 (1971)

W.Hauffe: **Elektronenmikroskopische Untersuchungen zur Entwicklung der Abbaustruktur auf Metalloberflächen bei Beschuss mit 10keV-Argonionen**

Dissertation A, TU Dresden, 1971

W.Hauffe: **Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung der Ionenstrahlätzung bei streifendem Einfall der Ionen**

Exp. Technik der Physik **19**, 407 (1971)

W.Hauffe: **Grundlagen der Ionenstrahltechnologie: Elementarprozesse der Festkörperzerstäubung durch Ionenbeschuss**

Physik der Halbleiteroberfläche **7**, 26 (1976)

W.Hauffe: **Über den Einfluss der Einfallrichtung des Ionenstrahls auf die Richtungsverteilung der emittierten Atome und die Reliefentwicklung bei der Zerstäubung von Ag- und Fe-Einkristallen**

Proc. 4. Konferenz „Wechselwirkung atomarer Teilchen mit dem Festkörper“
Charkov (UdSSR) 1976, Bd.I, S.104

W.Hauffe: **Vorrichtung zur Vorbereitung der Stoffproben für die Untersuchung,**

Patentschrift WP 139 670 (1977)

W.Hauffe: **Untersuchung der Richtungsverteilung emittierter Atome und der Oberflächenveränderungen bei der Ionenstrahlzerstäubung von Festkörpern**

Dissertation B, Dr. sc. nat. (Umwandlung in Dr. rer. nat. habil. 1991), TU Dresden, 1978

W.Hauffe: **New Observations and a Model of the Cone Formation on Amorphous and Crystalline Solid Surfaces during Ion Bombardment**

Proc. Int. Conf. Ion Beam Modification of Materials (IBMM), Budapest 1978, p.1079

W.Hauffe: **Einsatz der Ionenstrahlzerstäubung im Rasterelektronenmikroskop zur Lösung von Problemen der Mikroelektronik**

Proc. Symp. Phys. Grundlagen zu Bauelementetechnologien der Mikroelektronik, Frankfurt/O.
1979, S.169

W.Hauffe: **Vorrichtung zur Materialbearbeitung mit Ionenstrahlen**

Patentschrift WP 152 232 (1980)

W.Hauffe: **Surface Topography Development during SIMS Investigations and Using It to Get**

Additional Information on Polycrystalline and Heterogeneous Solids

Proc.3. Int. Conf. SIMS, Budapest 1981, in Springer-Ser. Chem. Phys. Vol. **19**, p. 82

W.Hauffe: Vorrichtung zur Herstellung von Dünnschnitten für die Durchstrahlungselektronenmikroskopie

Patentschrift WP 218 954 (1982)

W.Hauffe: Modifizierung des Ionenstrahl-Böschungsschnitt-Verfahrens zur Untersuchung von Schichtsystemen und Bondkontakten

Physik der Halbleiteroberfläche **14**, 133 (1983)

W. Hauffe: Ion Beam Microtome for Preparation of TEM Samples

Proc. 8. Europ. Kongress Elektronenmikroskopie (EUREM '84), Budapest 1984, Vol. 1, S.105

W.Hauffe: Ion Beam Slope Cutting (IBSC) for Investigation of Bonding Contacts and Layer Systems of Microelectronic Components

Electronica (Polen) **26**, H.4/5, p.3 (1985)

W.Hauffe, Ion Beam Slope Cutting with Scanning Electron Microscopy for Investigation of Hybrid Microelectronic Components

Proc. 10. Sci. Conf, Hybrid Microelectronics, Krakow 1986

W.Hauffe, T.Chudoba: Redepositionseffekte bei der Erzeugung von Ionenstrahl-Böschungsschnitten durch Halbleiter-Schichtsysteme

Physik der Halbleiteroberfläche **17**, 235 (1986)

W.Hauffe: Eine neue Ionenstrahl-Apparatur zur Präparation von Halbleiterschichtsystemen und Mikrostrukturen für die Analyse

Physik der Halbleiteroberfläche **18**, 25 (1987)

B.Schuman, G.Kühn, W.Gasch, G.Wagner, R.Flagmeyer, O.Müller, W.Hauffe

Epitaxial CaSrF₂/GaAs(100) Heterostructures Grown by Flash Evaporatio Technique

J. of Crystal Growth **82**, 405 (1987)

W.Berger, U.Ludwig, W.Hauffe, F.E.Karasz: Cold Drawing of Polyethylene Terephthalate/Polyethylene Films

J. of Appl. Polymere Science (USA) **34**, 919 (1987)

W.Hauffe, B.Schultrich,

Application of Ion Beam Slope Cutting for Investigation of the Near-Surface Structure of Laser-Modified Hardmetals

Praktische Metallography **25**, 517 (1988)

B.Böhm, W.Hauffe:

Zur Untersuchung von Komposit-Schmelz-Schichtsystemen mit Hilfe des Ionenstrahl-Böschungsschnitt-Verfahrens

Zahn-, Mund- u. Kieferheilkunde **76**, 134 (1988)

D.Grambole, F.Herrmann, W.Hauffe, Large-depth profiling of hydrogen by line scans of the nuclear microbeam over slope planes cut with an ion beam

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B77 (1993) 117 - 122

B.Böhm, W.Hauffe, P.Neumann, H.Nossek, H.Weise

Werkstoff- Grenzzonenmikromorphologie eines Glasionomerkement-Unterfüllungsmaterials
Zahn-Mund-Kieferheilkunde **78**, 727 (1990)

A.Dziedzic, L.I.Golonka, W.Hauffe: **Application of ion etching to microscopic investigation of LTCC structures**

Proc, ELTE 2000, Polanica Zdroj (Polen), p. 25 – 28 (2000)

W.Hauffe, S.Pannicke, S.Däbritz, P.Schade: **Combined application of ion beam slope cutting and SEM/EDX for investigation of the surface layer system on tungsten microwires after tribological treatment**

Surface and Interface Analysis **34**, 786 -789 (2002)

W.Hauffe, D.Glöss: **Ion Beam Grid Cutting with Gatan PECS for 3D-Scanning Electron Microscopy and Microanalysis of Integrated Circuits and Layered Structures**

Microscopy and Microanalysis, Vol, 8, Suppl. 3, 146 (2003) Cambridge University Press

M.Zier, W.Hauffe: **Computer Simulation of the Topography Evaluation on Ion Bombarded Surfaces**

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B **202**, 182 (2003)

(Auswahl aus ca. 200 Veröffentlichungen)

Buchbeiträge

W.Hauffe: **Production of Microstructures by Ion Beam Sputtering**

Kapitel 6 in **Sputtering by Particle Bombardment III**

(Eds. R.Behrisch, K.Wittmaack)

Vol. 64 Springer-Serie Topics in Applied Physics (1991) p. 305 - 338

W.Hauffe: **Ion Bombardment Experiments**

Kapitel 9 in **In situ Scanning Electron Microscopy in Materials Research**,

(Eds. K.Wetzig u. D.Schulze) p. 195 - 218

Akademie Verlag VSH Verlagsgruppe

W.Hauffe, Effekte **Ionenstrahlen** und **Festkörperzerstäubung**,
in **Effekte der Physik und ihre Anwendungen**

(Hsgb. M.v.Ardenne, G.Musiol, U.Klemradt)

Wissenschaftlicher Verlag Harri Deutsch, 3.Aufl. 2005

